

STANOWISKO DO POMIARU TŁUMIENNOŚCI CIENKICH MATERIAŁÓW ABSORPCYJNYCH



Widok stanowiska pomiarowego

Stanowisko pomiarowe wyposażone jest w mikrofalowy zestaw pomiarowy. Za pomocą opracowanego zestawu pomiarowego możemy dokonać pomiaru i wyznaczyć wartości zespolonych współczynników macierzy rozproszenia, które w dalszej kolejności mogą służyć do wyliczenia współczynników tłumienia i absorpcji danego materiału ekranującego. Zestaw pomiarowy w obecnej konfiguracji umożliwia pomiary w zakresie częstotliwości $45 \text{ MHz} \div 6 \text{ GHz}$.

Możliwości stanowiska

Pomiar zespolonych współczynników macierzy rozproszenia w paśmie od $45 \text{ MHz} \div 6 \text{ GHz}$
 Badanie obiektów materiałowych
 Badanie obiektów o małych grubościach

Aparatura

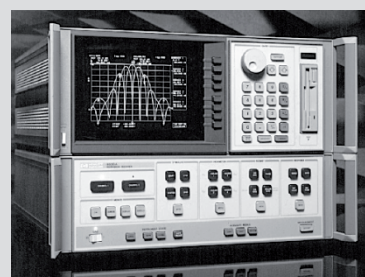
Analizator sieci HP 8510 – Hewlett Packard
 Generator sygnałowy SMF100B - Rohde & Schwarz
 Mikrofalowy zestaw pomiarowy



Zestaw pomiarowy



Adaptory kalibracyjne



Analizator sieci HP 8510